

裕隆时代 YL-2011 型离子减薄仪

2011型离子减薄仪是专业的样品处理系统，适用于 SEM、TEM、XTEM 及 FIB 等精密观测仪器，可以更为清楚的将材料自然状态下的微观结构展现出来。仪器适用性广泛，可对金属、非金属、陶瓷、矿物、半导体、骨骼、牙齿等几乎所有固体材料进行精密减薄处理。

产品特点

- 双样品台
- 离子束流自动控制
- 监视系统采用聚光光源
- 减薄过程无离子束遮挡
- 防污染观测系统
- 结构紧凑，体积小，精密设计，防误操作系统
- 样品洁净，样品信息更为真实可靠



技术参数

离子束加速电压	0-10KV 连续可调
最大束流密度	大于 200 μ A/cm
减薄速度 (铜)	30 μ /h (最大)
样品对离子束的倾角	5-90° (普通台) 0-90° (精细抛光台)
真空度	5 \times 10 ⁻³ Pa (不送气)
离子束对样品的最小倾角	7° (普通试样台) 2° (抛光试样台)
选购件	低温样品台